



触媒内細孔の観察

山田博史
名古屋大学

キーワード：X線CT，固体触媒，細孔内拡散

1. 背景と研究目的

固体触媒を用いて反応を行う場合、触媒粒表面まで原料が移動してきてその後触媒内の細孔を反応の活性点まで拡散していく。触媒が有効に利用されるためには触媒全体に原料が素早く拡散していく必要がある。この拡散という現象は細孔の構造(主に細孔径)に強く影響される。細孔径が十分に大きいと原料分子は分子同士の衝突をしながら細孔内を拡散(分子拡散)していく。それに対して、細孔径が小さいと分子同士の衝突だけでなく細孔壁にも当たりながら細孔内を拡散(クヌーセン拡散)していくことになる。触媒の性能向上のためには活性点の改良だけでなく細孔構造の改良も必要である。しかし、こういった観点からの触媒開発はあまり行われていない。そこで本研究ではあいちシンクロトロン光センターでX線CTを用いて触媒細孔の撮影が可能かの確認を行った。

2. 実験内容

実際の固体触媒を試料ホルダーに紫外線硬化樹脂で固定した。このサンプルをBL8S2の単色X線(17 keV, 12.4 keV)でCT撮影を行った。カメラの分解能は $6.5 \mu\text{m}$ である。また、触媒の種類を変えて素材ごとの見え方の違いについても検討できるようにした。

3. 結果および考察

いままで活性炭担体の触媒について報告してきた。触媒に用いられる担体の種類は多い。今回は代表的な担体であるアルミナを撮影した(Aldrich製Pd/Al₂O₃ペレット触媒。φ3.2 mm x 3.5 mm)。Fig.1に12.4 keVでの撮影結果を示す。細孔は判別できなかった。Fig.2に17 keVでの撮影結果を示す。この条件ではアルミナ担体内の細孔が確認できた。活性炭触媒は触媒の増感処理が必要であったが、アルミナはそのまま細孔解析をするのに十分な画質の映像が得られた。ただし、撮影時のエネルギーには注意が必要である。

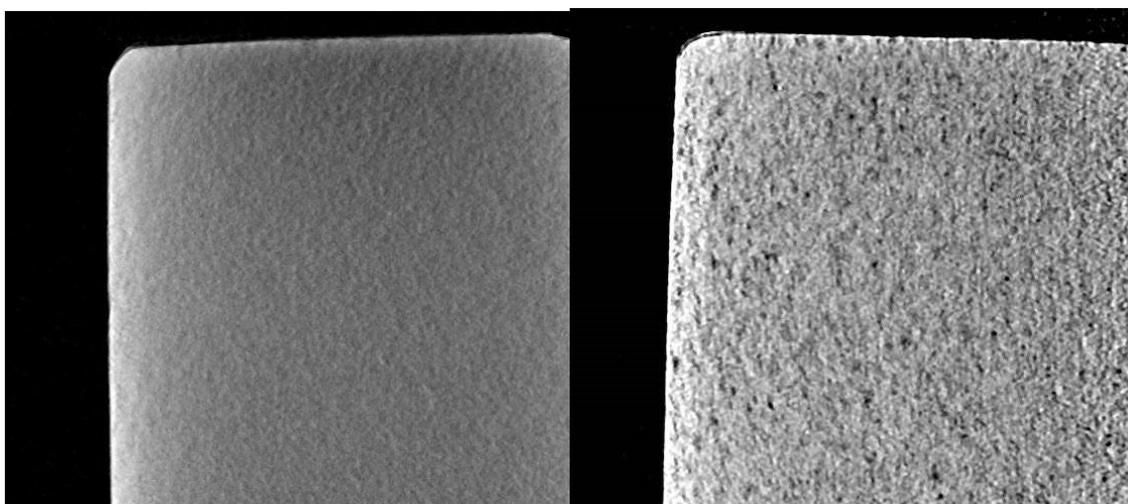


Fig.1 12.4 keVで撮影

Fig.2 17 keVで撮影